

# LASERSCANNING-MIKROSKOP

## TYP

VK-X1100, Keyence Deutschland GmbH

## LEISTUNGSSPEKTRUM

- Oberflächen- und Profilanalyse (z. B. Rauheitsmessungen nach ISO-Norm)
- Vermessung von 3D-Oberflächen und Erzeugung von 3D-Datensätzen zu Abgleichs- oder Simulationszwecken

## TECHNISCHE DATEN

### Spezifikationen Messobjektiv:

Vergrößerung	Bildfeld	Arbeitsabstand
5x	3,7 mm × 2,7 mm	22,50 mm
10x	1,8 mm × 1,4 mm	16,50 mm
20x	924 µm × 693 µm	3,10 mm
50x	370 µm × 277 µm	0,35 mm
100x	185 µm × 138 µm	2,00 mm

### optische und mechanische Spezifikationen:

- konfokale Lochblendenoptik mit ND-Filtern
- Detektoren:
  - PMT mit 16 Bit Dynamikumfang
  - Farb-CMOS-Chip-Kamera zur Probenbeobachtung und Fokusvariation
- Auflösung Höhenmessung: 0,5 nm (Wiederholgenauigkeit von 12 nm beim 50x Objektiv)
- XY-Objekttisch: 100 mm × 100 mm, motorisiert
- Laserlichtquelle: 404 nm, 1 mW
- koaxiale und Auflichtringbeleuchtung

### Fraunhofer-Anwendungszentrum für Anorganische Leuchtstoffe

Außenstelle des Fraunhofer IMWS

Lübecker Ring 2  
59494 Soest

Ansprechpartner  
Dr. Bernd Ahrens  
Telefon +49 2921 378-3554  
bernd.ahrens@imws.fraunhofer.de

[www.awz-soest.fraunhofer.de](http://www.awz-soest.fraunhofer.de)

### IN ZUSAMMENARBEIT MIT